

# TestStation LH™ インサーキット テストシステム

## リーズナブルな価格の高品質インサーキットテスト

### 主要機能

- 高フォルトカバレッジ
- 安全性の高い低電圧テスト
- 高テストスループット
- 抜群の診断精度
- 実証済みのテスト信頼性
- スケーラブルなテスト機能
- 低い保有コスト
- ハイピンカウント
- 小フットプリント



TestStation LH は、今日の新しい低電圧テクノロジーの高精度および高信頼性、高安全性のテスト向けの SafeTest プロテクションテクノロジーを備えています。

TestStation LH は、好評を得ている受賞製品 Teradyne TestStation 12X のファミリー製品で、リーズナブルな価格、小フットプリント、スケーラブルな機能を持つインサーキット テストシステムです。TestStation LH システムは、新しい低電圧テクノロジーの精度および信頼性、安全性の高い電力使用テスト向けのテラダインの SafeTest™ プロテクションテクノロジーに電圧精度とバックドライブ電流計測が搭載されています。

TestStation LH システムは、エレクトロニクス製品の量産製造メーカーにとって、費用対効果の高いインサーキットテストソリューションです。TestStation LH システムは、多くの製造メーカーが 228X および TestStation インサーキットテストへの投資を無駄にしないように設計されています。テストプログラムおよび小さなテストフィクスチャー（16ピンボードスロット未滿を使用している場合）を、余分なコストやプログラム開発を必要とすることなく、直接移管することができます。LHシステム用に開発されたフィクスチャーやプログラムをテラダインの大型 7680 ピン TestStation LX プラットフォームに簡単に移管できるため、他のコスト削減も実現できます。

TestStation LH システムは、228X および TestStation 12X モデルの過去のバージョンに必要な多くのボードタイプを統合しました。その結果、システムパワーの低減、システム信頼性の向上、52%のフットプリント縮小化、20%~40%の価格引き下げを実現することができました。TestStation LH システムは、マルチ

プレクスまたは非マルチプレクスのピンカードで構成可能で、4096テストピンまで、ローピンカウント/ハイピンカウントのいずれのアプリケーションでも使用することができます。TestStation LH ハードウェアおよびソフトウェアの機能は拡張性があり、お客様のテストニーズの変化に合わせて、後から簡単に機能を付加することができます。

TestStation LH システムの電源を使用しないテスト機能には、ショートおよびベクトルレスオープンズ、アナログ試験が含まれます。電源使用のテスト機能には、デジタルデバイスのベクトル試験、アクセス箇所を低減したバウンダリスキャン試験、高速 FLASH デバイスおよび高速 ISP デバイスのプログラミング、周波数および時間イベント計測、同期ミクスドシグナルデバイスの試験、機能クラスタの試験が含まれます。

これらのテストはテラダインの自動テスト生成ソフトウェアを使って自動的に生成されるか、あるいはシンプルでパワフルなテストプログラミング言語を使って手動で作成することができます。

TestStation LH インサーキットテストは、他のインサーキットテストでは不可能な、精度、信頼性、安全性の高い電力使用テストテクノロジーを実現します。特許取得 SafeTest プロテクションテクノロジーおよび高品質テストソフトウェアの機能により、TestStation LH システムは業界最高のインサーキット テストソリューションを実現します。

**精度** – UltraPin Driver/Sensor はこれまでに開発されたピンの中で最も精度の高いインサーキット テストピンです。カスタム設計された、クローズドループ、低インピーダンスドライバは、最悪のバックドライブおよび欠陥ボード状態でも、プログラムされた電圧を低電圧コンポーネントに正確に供給します。45mV センサーの精度は、今日の 0.8V 低電圧ロジックコンポーネントにおいてさえ、ロジックの高しきい値および低しきい値を簡単に識別することができます。

**信頼性** – UltraPin カードの独自の回路は、リアルタイムでバックドライブ電流を計測し、正しく分離していないコンポーネントを報告することが可能です。また、過剰なバックドライブ電流を必要とする不確かなテストも識別することができます。ロジックレベルおよびバックドライブ電流、バックドライブ時間しきい値はすべて、ピンごとにプログラマブルで、有害な電圧および電流がボードに(たとえ欠陥があるボードであっても)適用されるのを確実に防ぎます。

**安全性** – TestStation のマルチレベルのデジタル アイソレーションソフトウェアが、操作しているあらゆるネットに自動的にデバイス出力を分離します。これにより、バックドライブ状態を最小限化し、バックドライブした出力がロジック状態を突然変えた場合に発生する有害な電圧スパイクを防ぎます。特殊デジタルコントローラは迅速にテストベクタを実行し、バックドライブ電流時間を最小限化し、オンボードアクティビティから起こる電圧スパイクの発生を減らします。

TestStation LH インサーキット テストシステムは、Teradyne のグローバルサポート & サービスロケーションおよび、Teradyne's Support Network (TSN) の有資格フィクチャーおよびプログラミングサービス会社により、ワールドワイドにサポートされています。TestStation LH システム、Teradyne のグローバルサポートロケーション、Teradyne Support Network の詳しい情報は、Webサイト [www.teradyne.com/cbti](http://www.teradyne.com/cbti) を参照してください。

## General System Features

- PC based programming and test using Windows® XP or Windows NT® operating systems
- Choice of multiplexed or non-multiplexed pin board options
  - TS121 LH (All real pins - max pincount 2048)
  - TS124 LH (one-to-four multiplexing ratio - max pincount 2048)
  - TS128 LH (one-to-eight multiplexing ratio - max pincount 2048)
  - TS128L LH (one-to-eight multiplexing ratio - max pincount 4096)
  - TS124L LH (one-to-four multiplexing ratio - max pincount 4096)
- High Performance analog instrumentation and 8 channel measurement matrix
  - Fast shorts and opens impedance measurements
  - Precision resistor, inductor, capacitor, diode, transistor, FET, OPAMP, SCR, and Zener device testing
  - Comprehensive vectorless test techniques for detecting open pins on connectors and components
  - Frequency and timing event measurements
  - Fully synchronized analog and digital subsystems for testing of mixed-signal devices such as ADC, DAC and CODECs
- High-Performance Digital Vector Testing:
  - Independent clock, sync, and trigger pins
  - Specialized digital controller able to emulate complex device timing sequences
  - Independent dual-level Driver and Sensor thresholds
  - Driver/sensor timing and voltage thresholds programmable per pin
  - Per pin programmable slew rates
- SafeTest Protection Technologies:
  - Low impedance pin driver enables testing of low voltage devices under backdrive conditions
  - 45mV sensor accuracy
  - Real-time backdrive current measurement reports
  - Programmable backdrive current and duration thresholds
  - Automatic driver verification
  - Fast test vector execution
  - Multi-Level Digital Isolation (MLDI) software
- Comprehensive and Fast Automatic Test Generation Software
  - Fast and simple CAD preparation using Teradyne's D2B Alchemist™ software
  - Selectable program preparation environments (228X or Navigate)
  - Analog, Digital, Boundary Scan, and Hybrid test generators and device model libraries
  - BasicSCAN model generator for devices with Boundary Scan testability circuitry
  - Tree2DTS model generator for devices with XOR and NAND tree testability circuitry
  - Panel Test development software
  - Automatic multi-level digital isolation and analog guarding
  - Scan pathfinder reduced access boundary scan test solution
  - Onboard programming software for performing FLASH and ISP PLD programming
  - Powerful test program language for easy creation of custom tests
  - Optional Chinese Operator User Interface
- Automated Test Quality Measurement and Debug Software:
  - Analyze software reports fault coverage and test reliability information
  - AutoDebug software attempts to debug failing or marginal tests
  - AutoAdjust software shifts or widens test limits to improve test reliability
  - AutoOptimize software optimizes instrument and program settings for maximum test throughput
  - Powerful data collection and data display software
- Easy to integrate with manufacturing automation equipment
- Compact footprint (43.5 x 35 inches)
- Program and fixture compatibility with most 228X and TestStation models

**TERADYNE**

Because Technology Never Stops

**EG** E-Globaledge Corporation

イーグローバレッジ株式会社

MS本部 第二部

〒153-0051

東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー 7F

TEL: 03-6412-6010 / FAX: 03-6412-6016

<http://www.e-globaledge.com>